

2017年度 第10回 LSI テストセミナー

日時：2018年3月6日(火) 10時～21時30分

場所：電気ビル共創館カンファレンス D

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 3F

TEL: 0120-222-084

10時00分～10時20分 会場設営・受付・オープニング 温 暁青(九州工業大)

10時20分～10時50分

メモリ搭載 LSI に対する消費電力エリア特定に関する研究

○児玉優也, 古賀千裕, 宮瀬紘平(九工大), Shyue-Kung Lu(台湾科技大), 温暁青, 梶原誠司(九工大)

10時50分～11時20分

酒造における醗温度監視システム

○上原優衣, 大竹哲史(大分大), 福羅隆元(福羅酒造)

11時20分～11時50分

コントローラ拡大を用いた順序回路の IP 保護の一考察

○橋立英実, 細川利典(日本大), 吉村正義(京都産業大)

休憩(11時50分～13時20分)

13時20分～13時50分

誤り修正論理合成手法を用いた論理暗号化の評価について

松永裕介(九州大)

13時50分～14時20分

The Impact of Production Defects on the Soft-Error Tolerance of Hardened Latches

Stefan Holst, Ruijun Ma, and Xiaoqing Wen

休憩 14時20分～14時35分

14時35分～15時5分

微小遅延テストを利用したハードウェアトロイ検出法

平本悠翔郎, 力野英, 大竹哲史(大分大)

15 時 5 分 ~ 15 時 35 分

低消費電力指向テスト圧縮アルゴリズム評価

越智小百合, 山崎紘史, 細川利典 (日本大), 吉村正義 (京産大)

15 時 35 分 ~ 16 時 5 分

オンラインテストのための入力系列生成方法とその評価

宮崎誉也, 吉村正義(京都産大), 武田俊, 細川利典 (日本大)

休憩 (16 時 5 分 ~ 16 時 20 分)

16 時 20 分 ~ 16 時 50 分

MOUSETRAP パイプライン回路の遅延テストの一検討

佐藤巧生, 大竹哲史 (大分大)

16 時 50 分 ~ 17 時 20 分

ブロックチェーンにおけるハッシュ関数の FPGA 実装について

橘 正意, 松浦 宗寛, 三宅 庸資, 加藤 隆明, 梶原 誠司 (九州工業大)

休憩 (17 時 20 分 ~ 18 時)

18 時 ~ 21 時 30 分

LSI テストに関する討論